

日本技術センターがお届けする

S-LIGHT NEWS

VOL. 7

2014年3月14日

S-Light ノウハウのご紹介

大変ご無沙汰しております。

長い沈黙を破り、ついにS-Lightのノウハウをカタチにしました。

今回は、ガラス基板やフィルム製品をターゲットにした、外観検査の事例紹介です。

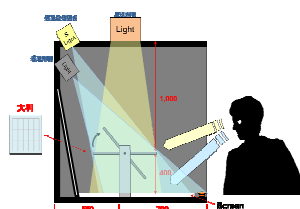
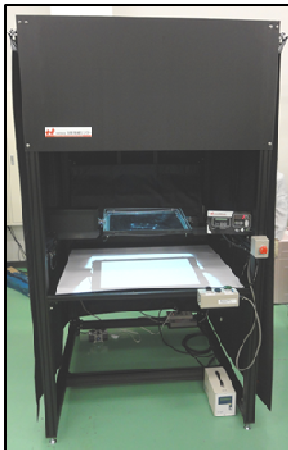
外観検査の事例紹介

(S-Light搭載目視type, ガラス基板向け)

各種製品の品質評価または製造時の工程内/最終の外観検査に利用できます。

検査に最適な照明環境を作り出すことにより、短時間で見逃しの無い外観検査を実現します。

カメラと組み合わせることで定量化にも応用できます。



例) Cover glass
BM印刷ムラ
反射投影検査

●外観検査コスト削減

- ・流出(見逃し)減・・・蛍光灯だけでは見逃しは無くならない!
多様な光(散乱、非散乱、超高輝度)を一瞬で切り替え
最適な見え方を作り出せます
- ・検査時間短縮
透明体、反射体の検査に高い威力を発揮する
S-Lightの投影検査により探し回る必要なし!

外観検査に挑戦し続ける日本技術センターは、これからも皆様の検査課題に挑戦していきます。

(記: 頼廣)



株式会社 日本技術センター
NIPPON GIJUTSU CENTER CO.,LTD.

〒670-0965 兵庫県姫路市東延末4-73

外観検査プロジェクト 足立

TEL : 079-225-3357 FAX : 079-225-3368

HP : <http://www.nichigicenter.co.jp>

アドレス : info-koho@nichigicenter.co.jp